## 材料分析测试技术 材料X射线衍射与电子显微分析



作者:周玉,武高辉编著

出版社:哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社

出版日期: 1998.08

总页数: 283

介绍:本书介绍了用X射线衍射和电子显微技术分析材料微观组识结构的原理、设备及试验方法。内容包括:X射线衍射方向与强度、多晶体分析方法及X射线法射仪、物相分析、宏观应力测定、透射电镜结构与原理等其他内容。

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10149350.html) 查找全本阅读方式

材料分析测试技术 材料X射线衍射与电子显微分析 评论地址:

https://www.jiaokey.com/book/detail/10149350.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10149350.html

书名: 材料分析测试技术 材料X射线衍射与电子显微分析